

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำขอบคุณ	ค
บทคัดย่อ	ง
Abstract	จ
รายการตารางประกอบ	ช
รายการภาพประกอบ	ณ
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 ทฤษฎี	3
2.1 ทฤษฎีพื้นฐานของผลึกควอเตอร์ซ์	3
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการระเหยสารในระบบสุญญากาศ	5
2.3 ทฤษฎีแถบพลังงานของของแข็ง	10
2.4 โครงสร้างของแถบพลังงาน	12
2.5 สมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ	12
บทที่ 3 อุปกรณ์และองค์ประกอบของระบบระเหยสาร	17
3.1 ระบบสุญญากาศ	17
3.2 อุปกรณ์และการวางตำแหน่งของอุปกรณ์ภายในครอบแก้ว	18
3.3 หม้อแปลงที่ใช้ระเหยสาร	24
3.4 ระบบควบคุมการระเหยสาร	26
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง	33
4.1 การทดสอบระบบระเหยสาร	33
4.2 การเตรียมอุปกรณ์ทำแผ่นฟิล์ม	40
4.3 การเตรียมแผ่นฟิล์ม	42
4.4 การทำขีวไฟฟ้าของแผ่นฟิล์ม การต่อขีวไฟฟ้า และการแอนโนไลต์แผ่นฟิล์ม	47
4.5 การศึกษาสมบัติของแผ่นฟิล์ม	50
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง ปัญหา และข้อเสนอแนะ	76
5.1 สรุปผลการศึกษาและทดสอบระบบการระเหยสาร	76
5.2 สรุปผลการเตรียมแผ่นฟิล์มบางอินเดียมซีลีเนียม	77

เรื่อง	หน้า
5.3 สรุปผลการตรวจสอบโครงสร้างผลึกของแผ่นฟิล์มบางอินเดียมซิลิเนียม	77
5.4 สรุปผลการทำชีวไฟฟ้าของแผ่นฟิล์มบางอินเดียมซิลิเนียม	78
5.5 สรุปผลสมบัติทางไฟฟ้าของแผ่นฟิล์มบางอินเดียมซิลิเนียม	78
5.6 ปัญหาและข้อเสนอแนะ	79
เอกสารอ้างอิง	82
ภาคผนวก	83
ผนวก ก.	83
ผนวก ข.	90
ผนวก ค.	101
ผนวก ง.	102
ผนวก จ.	103
ผนวก ฉ.	106
ประวัติการศึกษา	109

รายการตารางประกอบ

ตารางที่	หน้า
3.1 แสดงคุณสมบัติของหม้อแปลงแต่ละตัว	24
4.1 แสดงค่าระยะ 1 ต่างๆของแผ่นฟิล์มแต่ละชั้น จากแนวของจุดระยะเหยยสารแต่ละจุด ถึงจุดกึ่งกลางของฟิล์มชั้นต่างๆ	46
4.2 แสดงค่ามวลของสารอินเดียม, สารซิลิเนียม, และความหนาของสารทั้งสองของแผ่นฟิล์มแต่ละชั้น	46
4.3 แสดงค่า d spacing ของนิกที่มีมุมเลี้ยวเบนต่างๆ	51
4.4 แสดงค่า d spacing จากการทดลองเปรียบเทียบกับจาก A.S.T.M.card	52
4.5 แสดงค่าช่องว่างแถบพลังงานของแผ่นฟิล์มที่ 6, แผ่นฟิล์มที่ 7 และแผ่นฟิล์มที่ 8	64
4.6 แสดงความเข้มแสงตกกระทบที่ระยะ 1 ต่างๆ เมื่อกำลังหลอดไฟมีค่า 97.18 วัตต์	67
ผ.จ.1 ข้อมูลการวัดความต้านทานและความเข้มแสงตกกระทบของแผ่นฟิล์มที่ 6	103
ผ.จ.2 ข้อมูลการวัดความต้านทานและความเข้มแสงตกกระทบของแผ่นฟิล์มที่ 7	104
ผ.จ.3 ข้อมูลการวัดความต้านทานและความเข้มแสงตกกระทบของแผ่นฟิล์มที่ 8	105
ผ.ฉ.1 ข้อมูลการวัดกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ที่อุณหภูมิห้อง ของแผ่นฟิล์มที่ 6	106
ผ.ฉ.2 ข้อมูลการวัดกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ที่อุณหภูมิห้อง ของแผ่นฟิล์มที่ 7	107
ผ.ฉ.3 ข้อมูลการวัดกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ที่อุณหภูมิห้อง ของแผ่นฟิล์มที่ 8	108

รายการภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
2.1	3
2.2	8
2.3	9
2.4	10
2.5	11
3.1	18
3.2	18
3.3	19
3.4	19
3.5	20
3.6	20
3.7	21
3.8	21
3.9	22
3.10	22
3.11	23
3.12	25
3.13	25
3.14	26
3.15	27
3.16	27
3.17	28
3.18	28
3.19	29
3.20	30
3.21	31

ภาพที่	หน้า	
3.22	แสดงแผนผังของระบบควบคุมการระเหยสาร 3 จุด โดยคอมพิวเตอร์	32
3.23	แสดงระบบสูญญากาศและระบบที่ใช้ระเหยสาร	32
4.1	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของผลึกควอเตอร์ทซ์ทั้ง 3 ตัวกับเวลา เมื่อไม่ทำการระเหยทั้ง 3 จุด	37
4.2	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของผลึกควอเตอร์ทซ์ทั้ง 3 ตัวกับเวลา เมื่อทำการระเหยสารทั้ง 3 จุด ภายใต้การควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์	38
4.3	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของผลึกควอเตอร์ทซ์ทั้ง 2 ตัวกับเวลา เมื่อทำการระเหยสารทั้ง 2 จุด ภายใต้การควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์	39
4.4	แสดงหน้าจอกที่ใช้เตรียมแผ่นฟิล์มและหน้าจอกที่ใช้ทำชิ้น	40
4.5	แสดงการติดตั้งหน้าจอกฟิล์ม, กระจกสไลด์ กับแผ่นรองรับ	41
4.6	แสดงการวางแนวของหน้าจอกฟิล์มกับจุดระเหยทั้ง 3	41
4.7	แสดงแผ่นกระจกสไลด์ก่อนการเตรียมฟิล์มและแผ่นฟิล์มบางที่เตรียมได้	43
4.8	แสดงระยะ 1 ต่างๆจากจุดระเหยที่ 2 และจุดระเหยที่ 3 ของฟิล์มแต่ละชิ้น	45
4.9	แสดงแผ่นฟิล์มที่ทำชิ้นไฟฟ้าด้วยสารทองแดง, อินเดียม, ทอง และเงิน	47
4.10	แสดงกาวเงิน, ลวดตัวนำ และแผ่นฟิล์มที่ต่อชิ้นไฟฟ้าแล้ว	48
4.11	แสดงเตาเผาที่ใช้แอนนิลแผ่นฟิล์มและเทอร์โมคัพเบิลที่ใช้วัดอุณหภูมิ	49
4.12	แสดงผลจากการตรวจสอบโครงสร้างผลึกของแผ่นฟิล์มที่ไม่ได้ผ่านการแอนนิลกับ แผ่นฟิล์มที่ผ่านการแอนนิลแล้ว โดยใช้เอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์	50
4.13	แสดง A.S.T.M. card ของสารประกอบอินเดียมซิลิไซด์	52
4.14	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับส่วนกลับของอุณหภูมิ ขณะทำการ แอนนิลแผ่นฟิล์มที่ 6	54
4.15	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับส่วนกลับของอุณหภูมิ ขณะทำการ แอนนิลแผ่นฟิล์มที่ 7	55
4.16	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับส่วนกลับของอุณหภูมิ ขณะทำการ แอนนิลแผ่นฟิล์มที่ 8	56
4.17	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับส่วนกลับของอุณหภูมิ ที่บริเวณชิ้น ไฟฟ้าในลักษณะต่างๆ ขณะทำการแอนนิลแผ่นฟิล์มที่ 9	57

ภาพที่	หน้า
4.18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับส่วนกลับของอุณหภูมิ ที่บริเวณหัวไฟฟ้าในลักษณะต่างๆ ของแผ่นฟิล์มที่ 9 เมื่อผ่านการแอนนัลแล้ว	58
4.19 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับส่วนกลับของอุณหภูมิ ของแผ่นฟิล์มที่ 6 เมื่อผ่านการแอนนัลที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	60
4.20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับส่วนกลับของอุณหภูมิ ของแผ่นฟิล์มที่ 7 เมื่อผ่านการแอนนัลที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	61
4.21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับส่วนกลับของอุณหภูมิ ของแผ่นฟิล์มที่ 8 เมื่อผ่านการแอนนัลที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	62
4.22 แสดงชุดวัดความต้านทานและความเข้มของแสง	66
4.23 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงตกกระทบกับความต้านทานที่อุณหภูมิห้อง ของแผ่นฟิล์มที่ 6	68
4.24 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงตกกระทบกับความต้านทานที่อุณหภูมิห้อง ของแผ่นฟิล์มที่ 7	69
4.25 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงตกกระทบกับความต้านทานที่อุณหภูมิห้อง ของแผ่นฟิล์มที่ 8	70
4.26 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ที่อุณหภูมิห้อง ของแผ่นฟิล์มที่ 6	73
4.27 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ที่อุณหภูมิห้อง ของแผ่นฟิล์มที่ 7	74
4.28 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ที่อุณหภูมิห้อง ของแผ่นฟิล์มที่ 8	75
ผ.ก.1 วงจรควบคุมอุณหภูมิเตาต้มน้ำมันของปิมไอฟุ้งกระจาย	83
ผ.ก.2 วงจรออสซิลเลเตอร์ที่ใช้กับผลึกควอตซ์ความถี่ 4 เมกกะเฮิรตซ์	84
ผ.ก.3 วงจรนับเลขฐานสอง 24 บิต และรีจิสเตอร์เลื่อนข้อมูล	85
ผ.ก.4 วงจรสร้างฐานสัญญาณเวลา	86
ผ.ก.5 วงจรแปลงผันดิจิตอลเป็นแอนะล็อก	87
ผ.ก.6 วงจรควบคุมกำลังไฟเชิงสัดส่วน	88
ผ.ก.7 วงจรควบคุมอุณหภูมิมบนแผ่นรองรับ	89